

Model insights into energetic photoelectrons measured at Mars by MAVEN

S. Sakai, A. Rahmati, D. L. Mitchell, T. E. Cravens, S. W. Bougher, C. Mazelle, W. K. Peterson, F. G. Eparvier, J. M. Fontenla, and B. M. Jakosky

Geophys. Res. Lett., 42, 8894-8900, doi:10.1002/2015GL065169





- 太陽 EUV や X 線は高層大気中で エネルギーを蓄える [cf. Fox et al., 2008]
 - 電離や加熱過程に貢献
- 2001 年に火星起源の X 線を発見 [Dennerl, 2002]
 - 500 eV 以上の電子が存在する ことを示唆
 - X 線は C, O, N の K 殻からの 電離によって放出
 - メインではない
- ほとんどはオージェ電子として放出
 - ~99%



Soft X-ray image of Mars made by Chandra [*Dennerl*, 2002]

Model description



- コード群
 - Photon energy deposition code
 - 超熱的電子 (光電子) の生成率を高度とエネルギーの関数として計算
 - Inputs: 太陽フラックス,中性大気密度
 - Two-stream electron transport code
 - 光電子のアップフラックス、ダウンフラックスを計算
 - Inputs: 光電子生成率,中性大気・電子密度





- Heliospheric Environment Solar Spectrum Radiation (HESSR) model
 - Solar Irradiance Physical Modeling (SRPM) system
 - e.g., *Fontenla et al.* [2011]
 - http://www.galactitech.net/hessrdata/Mars/Spectra/
 - •太陽フラックスは1日毎のスナップショットを元に計算
 - 波長: 0.05-7.0 nm for dλ = 0.05 nm
 2.0-160.0 nm for dλ = 1.0 nm

Background atmosphere





- CO_2 , CO, N_2 , and O
 - Based on Bougher [2012] and Bougher et al. [2009 & 2014]





Suprathermal electron transport model

$$\langle \mu \rangle \frac{d\Phi^{\pm}}{ds} = -\sum_{k} n_{k}(s) (\sigma_{a}^{k} + p_{s}^{k} \sigma_{s}^{k}) \Phi^{\pm}(\varepsilon, s) + \sum_{k} n_{k}(s) p_{e}^{k} \sigma_{e}^{k} \Phi^{\mp}(\varepsilon, s) + \frac{q(\varepsilon, s)}{2} + q^{\pm}(\varepsilon, s)$$

・光電離、電子弾性・非弾性衝突断面積は Gan et al. [1990]
 より

cos α : pitch angle, σ_a^k : total inelastic collision cross-section for a neutral species k, p_s^k and s: electron backscatter probability and the cross-section, p_e^k and σ_e^k : elastic collision probability and the cross-section, q: photoelectron production rate due to direct photoionization, q^{\pm} : electron production ratedue to cascading from higher energy by inelastic collisions

Coordinate system



- 磁力線座標系 (放物線)
 - Apex: 100 km



Results





- > 50 eV での軟 X 線
- アップフラックスが卓越
 - 上部境界でのダウンフラックスは0



Comparison with SWEA



MAVEN/SWEA 2015-03-03 02:32:56



- フレアなし
 - SWEA とほぼ一致.
 - 4月1日の50 eV以下では不一致
 - 電子密度の SZA 依存性

Comparison with SWEA





Comparison with SWEA





• 太陽活動も電離圏の光電子分布に重要なパラメター!!





- 火星高層大気の光電子のエネルギーフラックスを調査
- オージェ電子 (250-500 eV) のフラックスは 1-2 nm の太陽フ ラックスに関連
- 10 eV 以下の光電子エネルギーフラックスは電離圏電子密度と 中性大気密度との比に依存
- 50 eV 以上の光電子エネルギーフラックスはシース電子や軟 X 線 (太陽活動) に依存
- これらのモデル群は、MAVENの更なる観測から、太陽 EUV・XUVを火星電離圏・熱圏の熱エネルギーに変換するような複雑なプロセスの更なる理解に貢献できる





- Bougher, S. W. (2012), Coupled MGCM-MTGCM Mars thermosphere simulations and resulting data products in support of the MAVEN mission, *JPL/CDP report*, pp. 1-9, 6 Aug.
- Bougher, S. W., A. Valeille, M. R. Combi, and V. Tenishev (2009), Solar cycle and seasonal variability of the Martian theremosphere-ionosphere and associated impacts upon atmospheric escape, *SAE Int. J. Aerosp.*, *4*(1), 227-237, doi:10.4271/2009-01-2396.
- Bougher, S. W., T. E. Cravens, J. Grebowsky, and J. Luhmann (2014), The aeronomy of Mars: Characterization by MAVEN of the upper atmosphere reservoir that regulates volatile escape, *Space Sci. Rev.*, *182*, doi:10.1007/s11214-014-0053-7.
- Dennerl, K. (2002), Discovery of X-rays from Mars with Chandra, *Astron. Astrophys.*, 394, 1119-1128, doi:10.1051/0004-6361:20021116.
- Fontentla, J. M., J. Harder, W. Livingston, M. Snow, and T. Woods (2011), Highresolution solar spectral irradiance from extreme ultraviolet to far infrared, *J. Geophys. Res.*, *116*, D20108, doi:10.1029/2011JD016032.
- Fox, J. L., M. I. Galand, and R. E. Johnson (2008), Energy deposition in planetary atmospheres by charged particles and solar photons, *Space Sci. Rev.*, *139*, 3-62, doi: 10.1007/s11214-008-9403-7.
- Gan, L., T. E. Cravens, and M. Horanyi (1990), Electrons in the ionopause boundary layer of Venus, *J. Geophys. Res.*, *95*, 19023-19035, doi:10.1029/JA095iA11p19023.

Auger electrons



酸素オージェ電子

 $O + hv \rightarrow O^{+*} + e^{-}$ $O^{+*} \rightarrow O^{++} + e^{-} \quad (\sim 0.999 \text{ branching ratio, Auger electrons})$ $O^{+*} \rightarrow O^{+} + hv \quad (\sim 0.001 \text{ branching ratio, Auger X - ray})$

- 酸素オージェの3つのピーク
 - ~490 eV
 - ~495 eV

• ~500 eV

